

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2025년 1월 23일 (23.01.2025)



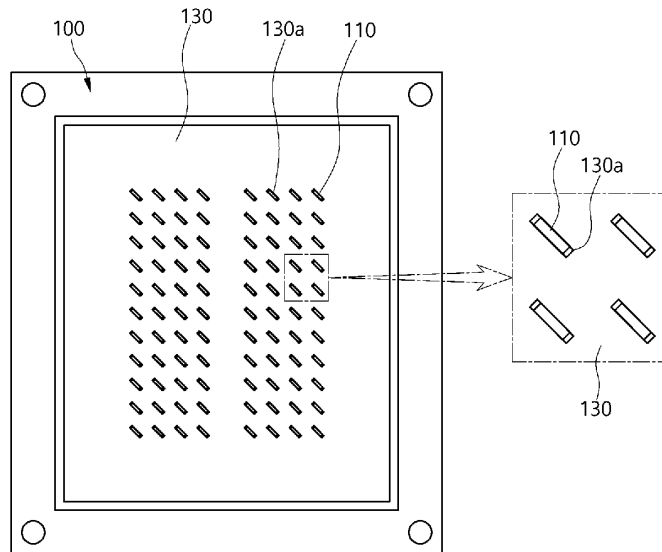
(10) 국제공개번호

WO 2025/018636 A1

- (51) 국제특허분류:
G01R 1/04 (2006.01) *G01R 3/00* (2006.01)
G01R 1/067 (2006.01) *G01R 31/28* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2024/008990
- (22) 국제출원일: 2024년 6월 27일 (27.06.2024)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2023-0094359 2023년 7월 20일 (20.07.2023) KR
10-2023-0180980 2023년 12월 13일 (13.12.2023) KR
- (71) 출원인: 주식회사 비이링크 (BELINK CO.,LTD.) [KR/KR]; 13207 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 6층 610호, Gyeonggi-do (KR). 주식회사 새한마이크로텍 (SAE HAN MICRO TECH CO., LTD.) [KR/KR]; 12018 경기도 남양주시 진접읍 금강로1845번길 7, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 박연호 (PARK, Yeon Ho); 16994 경기도 용인시 기흥구 어정로 80, 105동 1302호, Gyeonggi-do (KR). 박상영 (PARK, Sang Young); 17372 경기도 이천시 애련정로 67-23, 101동 3201호, Gyeonggi-do (KR). 이재형 (LEE, Jaehyoung); 18441 경기도 화성시 탄요 1길 28-1, Gyeonggi-do (KR). 김석민 (KIM, Sukmin); 12285 경기도 남양주시 다산중앙로 146번길 7, 2209동 2103호, Gyeonggi-do (KR). 박준철 (PARK, Juncheol); 11800 경기도 의정부시 수암로25, 2004동 302호, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 이룸리온 (ERUUM & LEEON INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM); 06575 서울특별시 서초구 사평대로 108, 3층 (반포동), Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) Title: RUBBER SOCKET APPARATUS FOR TESTING CIRCUITS OF ELECTRONIC DEVICE

(54) 발명의 명칭: 전자 소자의 회로 검사용 러버 소켓 장치



(57) Abstract: Disclosed is a rubber socket apparatus for testing circuits of an electronic device, the apparatus having a shielding layer or a film that can remove signal noise. The rubber socket apparatus for testing circuits of an electronic device, according to one aspect of the present invention, may comprise: a plurality of test pins aligned so that circuits of an electronic device can be tested; a rubber layer in which the plurality of test pins are embedded upright; and a shielding film which is in close contact with either the upper surface or the lower surface of the rubber layer for shielding or signal noise reduction.

(57) 요약서: 차폐층 또는 신호 노이즈 제거가 가능한 필름을 구비한 전자 소자의 회로 검사용 러버 소켓 장치가 개시된다. 본 발명의 일 측면에 따른 전자 소자의 회로 검사용 러버 소켓 장치는, 전자 소자의 회로를 검사할 수 있도록 배열된 복수개의 테스트용 핀; 상기 복수개의 테스트용 핀이 세워져 내장된 러버층; 및 상기 러버층의 상부면 또는 하부면 중 어느 한 면에 밀착되어 차폐 또는 신호 노이즈를 감소시키는 차폐 필름;을 포함할 수 있다.

[다음 쪽 계속]



WO 2025/018636 A1

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))